

Produktdatenblatt

LEBENSDAUERTEST VON ELEKTRONISCHEN SENSOREN



Bel. Zähler	Zeit	PHI	PK	Prüfbedingung	Messwert	Tot.Min.	Tot.Max.	Einb.
0000001	26.07.2005	01	32	Phase U - Ausgangspegel High [mV]	5018,21	4500,00	5050,00	mV
0000001	26.07.2005	01	30	Phase U - Anstiegszeit [us]	272,75	20,00	350,00	us
0000001	26.07.2005	01	30	Phase U - Abfallzeit [us]	1,12	0,00	5,00	us
0000001	26.07.2005	01	34	Phase W - Flanken / Umdrehung	6,00	6,00	6,00	cm
0000001	26.07.2005	01	45	Phase U - Testverhältnis [%]	57,17	55,00	65,00	%
0000001	26.07.2005	01	32	Phase W - U Ausgangspegel Low [mV]	24,41	10,00	500,00	mV
0000001	26.07.2005	01	32	Phase W - U Ausgangspegel High [mV]	5017,40	4500,00	5050,00	mV
0000001	26.07.2005	01	30	Phase W - Anstiegszeit [us]	269,34	30,00	350,00	us
0000001	26.07.2005	01	30	Phase W - Abfallzeit [us]	1,05	0,00	5,00	us
0000001	26.07.2005	01	34	Phase W - Flanken / Umdrehung [cm]	6,00	6,00	6,00	cm
0000001	26.07.2005	01	45	Phase W - Testverhältnis [%]	59,06	55,00	65,00	%
0000001	26.07.2005	01	32	Phase V - U Ausgangspegel High [mV]	24,41	10,00	500,00	mV
0000001	26.07.2005	01	30	Phase V - U Ausgangspegel Low [mV]	5019,23	4500,00	5050,00	mV
0000001	26.07.2005	01	30	Phase V - Anstiegszeit [us]	276,91	30,00	350,00	us
0000001	26.07.2005	01	30	Phase V - Abfallzeit [us]	1,39	0,00	5,00	us
0000001	26.07.2005	01	34	Phase V - Flanken / Umdrehung [cm]	6,00	6,00	6,00	cm
0000001	26.07.2005	01	45	Phase V - Testverhältnis [%]	60,44	55,00	65,00	%
0000001	26.07.2005	01	31	U to W - Phase - Shift [°]	116,90	110,00	120,00	°
0000001	26.07.2005	01	31	U to V - Phase - Shift [°]	230,30	200,00	240,00	°
0000001	26.07.2005	02	33	Stromaufnahme low	16,38	6,00	20,00	mA
0000001	26.07.2005	02	32	Phase D - Ausgangspegel Low [mV]	24,41	10,00	500,00	mV
0000001	26.07.2005	02	32	Phase U - Ausgangspegel High [mV]	5018,21	4500,00	5050,00	mV
0000001	26.07.2005	02	30	Phase U - Anstiegszeit [us]	267,44	30,00	350,00	us
0000001	26.07.2005	02	30	Phase U - Abfallzeit [us]	1,13	0,00	5,00	us
0000001	26.07.2005	02	34	Phase U - Flanken / Umdrehung	6,00	6,00	6,00	cm
0000001	26.07.2005	02	45	Phase U - Testverhältnis [%]	59,50	55,00	65,00	%
0000001	26.07.2005	02	32	Phase W - U Ausgangspegel Low [mV]	26,53	10,00	500,00	mV

KURZBESCHREIBUNG

Mit dieser Anlage werden elektronischen Sensoren einem Dauertest unterzogen. Die Prüfung findet in dafür vorgesehenen Klimaschränken unter sich verändernden Temperaturen und Feuchtwerten statt.

KUNDENANFORDERUNGEN

- Händische Bauteilbestückung in die Anlage
- Typbezogene Langzeitprüfung
- Ansteuerung des Klimaschranks (-40 bis +80°C, 10% bis 90% Feuchtigkeit)
- Innovative und servicefreundliche Bedienung
- Fehlerhistorie
- Statistische Auswertung

TECHNISCHE DETAILS

- Siemens IPC mit Windows XP
- multilinguale Kutzschbach-Software:
  - KE-Sequencer: Auswertung der Messergebnisse
  - KE-Statistics: Statistik der Messwerte und Anzeige

FAZIT und IMPLEMENTIERUNG

Mit dieser Prüfanlage wurde ein kundenindividuelles und flexibles System zur Langzeitprüfung entwickelt. Über einen monatelangen Zeitraum kann so ein Test unabhängig von Eingriffen und ohne Überwachung durchgeführt werden.